

SOLIDSTATE

SOLIDSTATE (Solid State and Superconductivity Abstracts) は、金属材料、プラスチック材料、セラミック材料の応用、物理学、超伝導などの固体研究についての情報を収録する Cambridge Scientific Abstracts 製作の文献データベースです。このファイルには、研究レポートと政府レポートの両者が収録されています。SOLIDSTATE は、冊子体の Solid State and Superconductivity Abstracts Journal に対応しています。このファイルのレコードは、書誌情報、非統制語、抄録、標題を収録しています。

収録内容

固体研究に関する理論および応用文献	物理学
応用	問題領域
化学	共鳴
材料	超伝導理論
計測	
冶金学	

収録源

単行本	政府レポート
会議録	雑誌論文

ファイル内容

1981 年から現在まで
約 1,094,000 件以上のレコードを収録 (2011 年 7 月現在)
更新は毎月
アラート (自動 SDI 検索) は毎月実施

検索補助資料

オンラインヘルプ (HELP DIRECTORY で、利用できるすべてのヘルプメッセージが表示されます。)
STNGUIDE

データベース製作者

Cambridge Scientific Abstracts (CSA)
7200 Wisconsin Avenue
Suite 601
Bethesda, MD 20814
Phone: (301)961-6700
(800)843-7751
Fax: (301)961-0906
E-mail: support@csa.com

ヨーロッパ

STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe
P.O. Box 2465
76012 Karlsruhe
Germany
Phone: +49-7247-808-555
Fax: +49-7247-808-259
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
Internet: www.stn-international.de

日本

STN 東京

一般社団法人 化学情報協会

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)
: 0120-151-462 (上記以外)
Fax: 03-5978-4090
E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk)
customer@jaici.or.jp (上記以外)
Internet: www.jaici.or.jp

北アメリカ

STN コロンバス

CAS
P.O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A
CAS Customer Care:
Phone: 800-753-4227 (North America)
614-447-3700 (worldwide)
Fax: 614-447-3751
E-mail: help@cas.org
Internet: www.cas.org

SEARCHおよびDISPLAYフィールド

このファイルには後方一致検索可能なフィールドはありません。

フィールド	SERCH コード	SEARCH例	DISPLAY コード
基本索引 標題(/TI) 非統制語(UT) 抄録(AB) (以上からの切出し語)	/BI	S IMAGING/BI S CIRCULAR(A)DICHRO?	AB, UT, TI
レコード番号	/AN	S 88:16/AN	AN
著者名	/AU	S JONES R?/AU	AU
分類コード(コードと分類名) ²⁾	/CC	S MATERIAL#(A)TEST?	CC
機関名 ²⁾	/CS	S KANAGAWA/CS AND PY>=1991	CS
資料種類	/DT(または/TC)	S ABSTRACT/DT	DT, TC
入力日 ¹⁾	/ED	S ED>921000	表示されない
フィールドの存在	/FA	S FERROMAGNET? AND AB/FA	表示されない
ファイルセグメント(コードと テキスト)	/FS	S SOLID STATE ABSTRACTS/FS	FS
国際標準(資料)番号	/ISN	S 0-89252-726-9/ISN	ISN, SO
雑誌名	/JT	S ELECTRON TECH?/JT	JT, SO
言語	/LA	S (FR OR FRENCH)/LA	LA
会議開催日 ¹⁾	/MD	S 19860000<MD<19870000	MD
会議開催地	/ML	S SWEDEN/ML	ML, SO
会議名	/MT	S SPIE CONFERENCE/MT	MT, SO
会議開催年	/MY	S MY>=1990	MD, SO
レポート番号	/NR	S EUR?/NR	NR, SO
発行日 ¹⁾	/PD	S PD=19890000	SO
発行年 ¹⁾	/PY	S GLASS-FORM? AND 1989/PY	PY, SO
収録源 (雑誌名, 巻・号・ページ, 会議 情報, レポート番号, 発行日, ISSN, ISBNを含む)	/SO	S MAGNETIC!/SO	ISN, JT, ML, MT, NR, PD, PY, SO
抄録の言語(コードと言語名)	/SL	S GERMAN/SL	SL
標題	/TI	S RHEOLOG?/TI AND POLYPROPYLENE	TI
更新日 ¹⁾	/UP	S UP>=921000	表示されない

1) 数値演算子での検索あるいは範囲検索が可能な数値検索フィールドです。

2) このフィールドでは(S)演算子はスペースで代用できます。

D I S P L A Y および P R I N T 形式

回答のディスプレイとオフラインプリントには下記の表中の表示形式を自由に組み合わせることができます。複数のコードは、“D L1 1-5 TI AU” または “S L1 1-5 TI, AU” のようにスペースやカンマで区切って下さい。フィールドは指定された順序で表示されます。以下の検索フィールドでハイライト機能が使えます。AB, AN, AU, CC, CS, DT, ISN, LA, PD, SL, SO, JT, MD, ML, MT, NR, PY, TC, TI, UT。ハイライト機能を使いたくない場合には SET HIGHLIGHT OFF と入力してください。デフォルトは ON になっています。HIT, KWIC, OCC 形式を使うためには、HIGHLIGHT 機能が ON になっている必要があります。

形式	英語名	内容	入力例
AB	Abstract	抄録	D L4 1-4 AB
AN	Accession Number	レコード番号	D L1 3 AN
AU	Author	著者名	D AU 1,3-5
CC	Classification Code	分類コード	D CC 5-10
CS	Corporate Source	機関名	D 1-3, 7, 8 CS
DT	Document Type	資料種類	D DT 1-5
FS	File Segment	ファイルセグメント	D I.1 FS 3
ISN	International Standard (Document) Number	国際標準(資料)番号	D ISN
JT	Journal Title	雑誌名	D JT 2
LA	Language	言語	D L8 LA 1-3
MD	Meeting Date	会議開催日	D 1, 4 MD
ML	Meeting Location	会議開催地	D L1 ML
MT	Meeting Title	会議名	D MT
NR	Number of Report	レポート番号	D NR L1 4
PY	Publication Year	発行年	D AB PY
SL	Summary Language	抄録の言語	D L3 SL
SO	Source	抄録源	D SO 2 L5
TC	Treatment Code	処理コード	D TC 2
TI	Title	標題	D L3 4 TI
UT	Uncontrolled Term	非統制語	D UT
ABS	AB		D L4 ABS CT
ALL	利用できる全ディスプレイフィールド(AN, TI, AU, CS, SO, DT, FS, LA, SL, AB, CC, UT)		D ALL 2
BIB	AN, TI, AU, CS, SO, DT, FS, LA, SL(デフォルト)		D 1, 4 L3 D BIB 6 L2
CBIB	AN, TI, AU, CS, SO, LA, SL		D L1 2 CBIB
IALL	フィールド名付きインデント型 ALL 形式		D 1-4 IALL
IBIB	フィールド名付きインデント型 BIB 形式		D L5 IBIB 2 7
IND	CC, UT		D IND, FS
SAM	TI, CC, UT		D SAM L3
SCAN ¹⁾	TI, CC, UT		D 5-8 SCAN
HIT	ヒットタームを含む全フィールド		D HIT
KWIC	前後20語付きヒットターム (Key-Word-In-Context)		D KWIC
OCC	ヒットタームとそれを含むフィールドの出現頻度		D OCC

1) 記事は、回答番号なしでランダム順で表示されます。

S E L E C T および S O R T フィールド

SELECT コマンドは回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にE番号を付与します。(該当項目にはY、該当しないものにはNで表示されています。)

SORT コマンドは、指定したフィールドのアルファベット順または数値順に検索結果を並び替えます。

フィールド	フィールドコード	S E L E C T ¹⁾	S O R T
抄録	AB	Y ²⁾	N
レコード番号	AN	Y	N
著者名	AU	Y	Y
分類コード	CC	Y	Y
機関名	CS	Y	Y
資料種類	DT	Y	Y
ファイルセグメント	FS	Y	Y
国際標準(資料)番号	ISN	Y ³⁾	N
国際標準図書番号	ISBN	N	Y
国際標準逐次刊行物番号	ISSN	N	Y
雑誌名	JT	Y	Y
言語	LA	Y	Y
会議開催日	MD	Y	Y
会議開催地	ML	Y	Y
会議名	MT	Y	Y
レポート番号	NR	Y	Y
ヒット語の出現回数	OCC	N	Y
発行日	PD	Y	Y
発行年	PY	Y	Y
収録源	SO	Y ⁴⁾	N
抄録の言語	SL	Y	Y
処理コード	TI(デフォルト)	Y	Y
標題	TC	Y	Y
非統制語	UT	Y ²⁾	N

1) ヒットタームだけを抽出させるには、HIT を使います。例：SEL HIT TI

2) /BI を付けます。

3) /ISN を付加すると、ISSN と ISBN がセレクトされます。

4) 特許番号をセレクトします。

5) /SO を付加すると、ISSN と ISBN がセレクトされず。

サンプルレコード

A L L 形式での表示

AN 92:228 SOLIDSTATE
TI Assessment of reheat cracking sensitivity of steels from their
chemical compositions.ASM '85 MATERIALS WEEK.
AU Tamaki, K.; Suzuki, J.
CS Mie Univ., Mie, Japan
SO vp. Summary only..
Meeting Info.: ASM '85 Materials Week. Toronto, Ontario (Canada).
14-17 Oct 1985.
DT Book
TC Conference; Abstract
FS S
LA English
AB Reheat cracking sensitivity of various Cr-Mo steels could be
evaluated by the critical restraint stress to produce cracking.
There exists a minimum value of the critical stress at about 1% Cr.
A critical phosphorus content, which is the threshold value to
produce cracking for each steel, has been found.
CC SCM2 ALLOY COMPOSITION - DENSITY, STOICHIOMETRY, HOMOGENIZATION;
SCM6 VOLUME DEFECTS - PORES, CRACKS, CAVITIES
UT steel; heating; stress; fracture

B | B 形式での表示

AN 91:1343 SOLIDSTATE
TI Observation of N- and S-shaped negative differential resistance
behavior in AlGaAs/GaAs resonant tunneling structure.
AU Wang, Y.H.; Hounq, M.P.; Wei, H.C.
CS Dep. Electr. Eng., Natl. Cheng-Kung Univ., Tainan, Taiwan
SO SOL. ST. ELECTRON., (1991) vol. 34, no. 4, pp. 413-418.
DT Journal
FS S
LA English
SL English

サンプルレコード (続き)

I B I B 形式での表示

ACCESSION NUMBER: 91:1343 SOLIDSTATE
TITLE: Observation of N- and S-shaped negative differential
resistance behavior in AlGaAs/GaAs resonant tunneling
structure.
AUTHOR: Wang, Y.H.; Hounq, M.P.; Wei, H.C.
CORPORATE SOURCE: Dep. Electr. Eng., Natl. Cheng-Kung Univ., Tainan,
Taiwan
SOURCE: SOL. ST. ELECTRON., (1991) vol. 34, no. 4, pp.
413-418.
DOCUMENT TYPE: Journal
FILE SEGMENT: S
LANGUAGE: English
SUMMARY LANGUAGE: English

SCAN 形式での表示

TI High-power individually addressable monolithic laser diode array.
CC SMED MASERS AND LASERS; SSP5
MAGNETO-OPTICS
UT semiconductor lasers; arrays; optics; disks; memory;
aluminum gallium arsenide